



2M STRUMENTI



**CARATTERIZZAZIONE NANOMECCANICA QUANTITATIVA
DELLE SUPERFICI
TRAMITE MICROSCOPIA A SONDA IN SCANSIONE**

Area della ricerca del C.N.R. - Bologna

16 Marzo 2010

Programma Scientifico

9,30 Registrazione

9.45 Benvenuto ed Introduzione

Breve presentazione 2M Strumenti e Veeco Instruments. Verranno inoltre illustrati gli obiettivi ed il programma della giornata.

10.00 Presentazione Multimode 8 e ScanAsyst

Presentazione del nuovo AFM Multimode 8 evoluzione del Multimode storico sistema di riferimento per imaging e spettroscopia di forza ad alta risoluzione. Il Multimode 8 è stato arricchito con la nuova tecnica ScanAsyst che rende automatica l'ottimizzazione della scansione permettendo risultati consistenti e di qualità in maniera facile e veloce

10.30 Caratterizzazione nanomeccanica quantitativa mediante Microscopia a Sonda in Scansione

Verranno illustrati vari approcci alla caratterizzazione meccanica quantitativa alla nanoscala mediante la Microscopia a Sonda in Scansione. In particolare le tecniche HarmoniX™ e PeakForce QNM.

Una serie di esempi applicativi illustrerà le capacità di questi recenti sviluppi tecnologici, sviluppati da Veeco Metrology, di caratterizzare quantitativamente su scala nanometrica un ampio range di materiali, misurandone il modulo elastico, la viscosità, l'adesione ed altri parametri meccanici.

11.00 *Coffee Break*

11.20 Dimostrazione pratica su AFM Veeco MultiMode 8 e PeakForce QNM

12.30 Discussione e Conclusioni

SCHEMA DI PARTECIPAZIONE

Cognome:
Nome:
Qualifica:
Università
Ist./ Dip.....
Azienda.....
Indirizzo:
Città/ Prov.:
CAP: Prov.:
Tel.:
Fax:
e-mail:
AREA DI RICERCA:
.....
.....

Informazioni generali

Data 16 MARZO 2010
Sede AREA DELLA RICERCA SCIENTIFICA
DEL C.N.R. DI BOLOGNA
Contatto 2M
Dott. Stefano Pergolini
(spergolini@2mstrumenti.com)
Tel. 340 4042473

Iscrizione Gratuita.
Per motivi organizzativi la preventiva iscrizione
è necessaria e deve pervenire entro
l' 8 Marzo 2010.

Gli interessati possono inviare
l'adesione
utilizzando la scheda di
partecipazione,
via fax al +39.06.86895241 o
tramite e-mail a
marketing@2mstrumenti.com

Garanzia di riservatezza: in conformità al Dlgs
n°196/2003 sulla tutela dei dati personali, La
informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati con
la massima riservatezza e saranno utilizzati al solo
scopo di inviareLe gratuitamente ns. materiale
illustrativo.



Organizza il workshop :

**Caratterizzazione
nano meccanica
quantitativa delle
superfici tramite
microscopia a sonda
in scansione**

**Area della ricerca
scientifica del C.N.R.
Bologna
16.03.2010 h. 09.00**